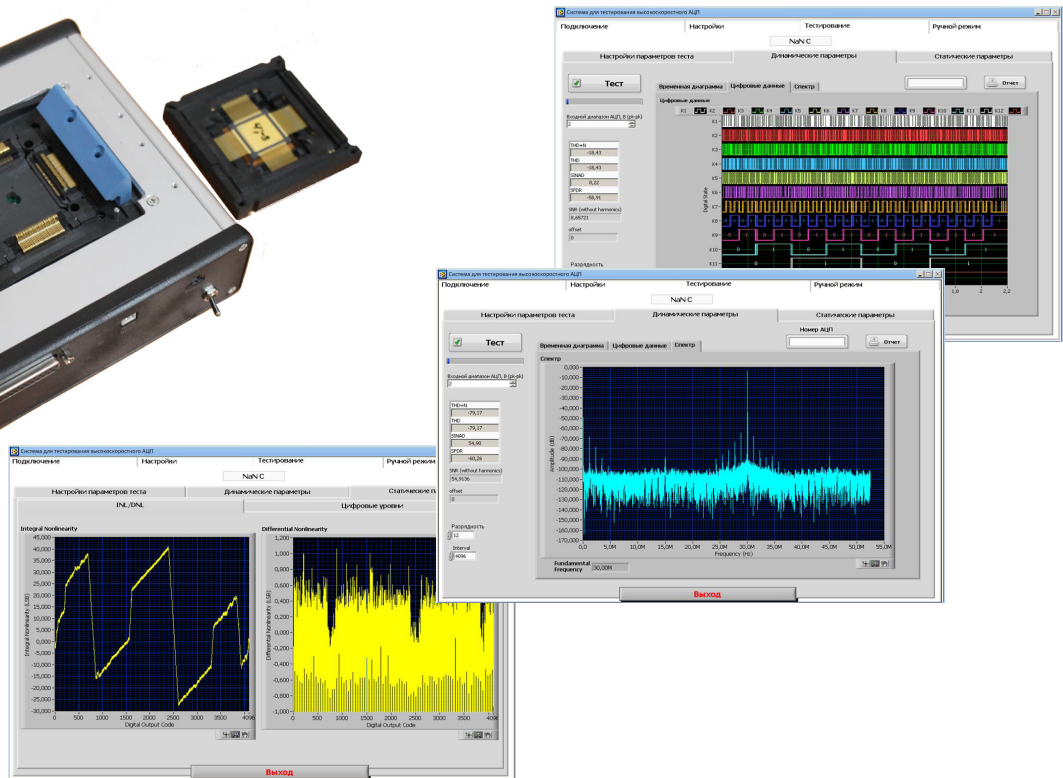
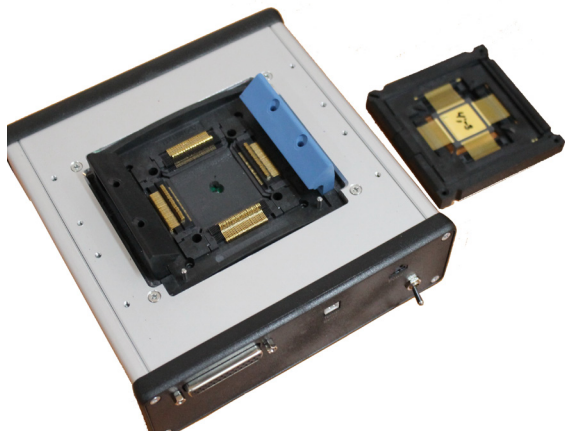


# Система тестирования высокоскоростных АЦП



## Обзор

Система представляет собой специальную оснастку и программное обеспечение для тестирования статических и динамических параметров высокоскоростных конвейерных АЦП с частотой оцифровки до 100 МГц, разрешением 12 бит и параллельным интерфейсом цифрового вывода. Система позволяет измерять следующие статические и динамические параметры АЦП:

- интегральная нелинейность;
- дифференциальная нелинейность;
- отношение сигнал/шум;
- динамический диапазон, свободный от паразитных составляющих;
- напряжение высокого уровня;
- напряжение низкого уровня;
- погрешность смещения.

Непосредственно на плате оснастки установлены высокостабильный генератор с частотой 1 ГГц и программируемый делитель с целью обеспечения высокой стабильности и малого джиттера тактового сигнала. Источник тактового сигнала программно можно выбирать или из внешнего модуля NI PXIe-6674T или из встроенного генератора. Оснастка микросхемы установлена в специальный корпус, позволяющий проводить тестирование микросхемы при разных климатических условиях: от  $-60^{\circ}$  до  $+80^{\circ}$  С.